

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



Docket No.: MUH-12624

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as First Class Mail in an envelope addressed to the Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on the date indicated below.

By: _____ Date: December 12, 2003

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applic. No. : 10/627,904
Applicant : Martin Freitag, et al.
Filed : July 25, 2003
Art Unit : 2818

Docket No. : MUH-12624
Customer No. : 24131

CLAIM FOR PRIORITY

Commissioner for Patents,
P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Claim is hereby made for a right of priority under Title 35, U.S. Code, Section 119, based upon the German Patent Application 101 03 313.3, filed January 25, 2001.

A certified copy of the above-mentioned foreign patent application is being submitted herewith.

Respectfully submitted,

For Applicant

Date: December 12, 2003

RALPH E. LOCHER
REG. NO. 41,947

Lerner and Greenberg, P.A.
Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100
Fax: (954) 925-1101

/av



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 101 03 313.3

Anmeldetag: 25. Januar 2001

Anmelder/Inhaber: Infineon Technologies AG, München/DE

Bezeichnung: MRAM-Anordnung

IPC: H 01 L, G 11 C

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 26. September 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ebert', is written over the printed name.

Ebert

Beschreibung

MRAM-Anordnung

5 Die vorliegende Erfindung betrifft eine MRAM-Anordnung (MRAM = magnetoresistiver RAM) aus einer Vielzahl von in einer Speichermatrix angeordneten Speicherzellen, deren jede aus wenigstens einer MTJ-Schichtfolge (MTJ = Magnetic Tunnel Junction) und einem Auswahltransistor besteht, von denen die
10 MTJ-Schichtfolgen jeweils zwischen Wortleitungen und Bitleitungen, die im Abstand voneinander verlaufen, gelegen sind, die Auswahltransistoren an ihren Gates zum Auslesen der Speicherzellen mit ersten Selectleitungen (Auswahlleitungen) verbunden sind und die MTJ-Schichtfolgen an zweite Se-
15 lectleitungen angeschlossen sind.

MRAM-Anordnungen - im folgenden auch kurz MRAMs genannt - bestehen in ihrer einfachsten Ausführungsform aus in einer Speichermatrix angeordneten Speicherzellen, deren jede je-
20 weils nur eine MTJ-Schichtfolge aufweist. Eine solche MTJ-Schichtfolge ist in Fig. 5 gezeigt: eine Tunnelbarrierenschicht 1 liegt zwischen einer weichmagnetischen Schicht 2 und einer hartmagnetischen Schicht 3 und besteht aus einer Oxidbarriere. Die Tunnelbarrierenschicht 1, die weichmagne-
25 tische Schicht 2 und die hartmagnetische Schicht 3 bilden so eine MTJ-Schichtfolge 4, deren elektrischer Widerstand von der Orientierung der magnetischen Momente in den beiden magnetischen Schichten 2 und 3 abhängt. Sind nämlich die Magnetisierungen in den beiden Schichten 2 und 3 parallel zu-
30 einander orientiert, so ist der Widerstand der MTJ-Schichtfolge 4 niedrig, während eine antiparallele Orientierung dieser Magnetisierungen einen höheren Widerstand der MTJ-Schichtfolge ergibt. Die Bestimmung des Zellinhaltes einer aus einer solchen MTJ-Schichtfolge gebildeten Speicher-
35 zelle wird dadurch gemessen, dass ein Strom I durch die MTJ-Schichtfolge 4 geschickt wird. Aus der Höhe dieses Stromes I

kann dann geschlossen werden, ob die MTJ-Schichtfolge 4 im Zustand eines hohen Widerstandes (antiparallele Orientierung der Magnetisierungen) oder im Zustand eines niedrigen Widerstandes (parallele Orientierung der Magnetisierungen) ist.

5 Jedem dieser Zustände kann dann ein Informationsinhalt "0" bzw. "1" zugeordnet werden.

Dies ist in Fig. 6 schematisch dargestellt, in welcher auf der Abszisse das durch entsprechende Ströme in den Bitlei-
10 tungen und Wortleitungen erzeugte Magnetfeld und auf der Ordinate der normierte Widerstandswert aufgetragen sind. Deutlich ist zu sehen, dass bei paralleler Orientierung der Magnetisierungen der Widerstand der MTJ-Schichtfolge 4 um etwa 15 % niedriger ist als bei antiparalleler Orientierung. Der
15 parallelen Orientierung der Magnetisierung ist hier der Informationsinhalt "0" zugeordnet, während die antiparallele Orientierung der Magnetisierung den Informationsinhalt "1" hat. Selbstverständlich sind aber auch andere Zuordnungen möglich.

20 Das Einschreiben in aus MTJ-Schichtfolgen 4 bestehende Speicherzellen erfolgt, indem die Orientierung der magnetischen Momente kontrolliert eingestellt wird. Hierzu wird die Speicherzelle zwischen zwei elektrische Leiter, nämlich eine
25 Bitleitung BL und eine Wortleitung WL platziert, wie dies in Fig. 7 dargestellt ist. Indem sodann geeignete Ströme durch diese Leitungen BL und WL geschickt werden, kann am Ort der MTJ-Schichtfolge 4, also in der aus dieser bestehenden Speicherzelle, ein Magnetfeld erzeugt werden, durch das die
30 Richtung der magnetischen Momente, also insbesondere die Richtung der magnetischen Momente in der weichmagnetischen Schicht 2, eingestellt werden kann. Um diese Einstellbarkeit der magnetischen Momente in der weichmagnetischen Schicht 2 der MTJ-Schichtfolge 4 zu gewährleisten, ist es in der Regel
35 ausreichend, wenn in einer der Leitungen BL und WL die Richtung des durch diese Leitung fließenden Stromes umgekehrt

werden kann. Durch entsprechendes Umschalten der Richtung dieses Stromes ist es also möglich, zwischen paralleler und antiparalleler Orientierung der Magnetisierungen und damit zwischen einem niederohmigen und einem hochohmigen Zustand
5 der Speicherzelle zu schalten.

In Fig. 8 ist der bereits erwähnte einfachste vorstellbare Aufbau einer MRAM-Anordnung dargestellt: MTJ-Schichtfolgen 4, die jeweils Speicherzellen bilden, liegen an den Kreuzungspunkten von jeweils parallel verlaufenden Wortleitungen
10 WL1, WL2, WL3 und Bitleitungen BL1, BL2. Eine bestimmte Speicherzelle wird beschrieben, indem beispielsweise durch die Bitleitung BL2 und die Wortleitung WL3 entsprechende Ströme geschickt werden. An der Kreuzungsstelle der Bitlei-
15 tung BL2 mit der Wortleitung WL3 (also in Fig. 8 ganz rechts) herrscht dann infolge dieser Ströme ein entsprechendes Magnetfeld, so dass die dort liegende MTJ-Schichtfolge bzw. die durch diese gebildete Speicherzelle entsprechend beschrieben wird.

20 Vorteilhaft an der in Fig. 8 gezeigten Anordnung ist deren hochdichte Gestaltung: pro Informationsinhalt bzw. Bit wird in vollkommen idealer Weise lediglich eine Fläche von $4 F^2$ benötigt, wobei F die "minimum feature size", also die
25 kleinstmögliche Merkmalsgröße, der verwendeten Technologie bedeutet. Als großer Nachteil einer solchen Gestaltung einer MRAM-Anordnung ist aber anzusehen, dass beim Auslesen infolge der nur geringfügigen Unterschiede im Widerstandswert (etwa 15 %; vgl. oben) erhebliche parasitäre Ströme durch
30 Nachbarzellen fließen, so dass eine solche MRAM-Anordnung insgesamt nur sehr langsam ausgelesen werden kann.

Um diesen Nachteil des langsamen und infolge der parasitären Ströme letztlich auch unsicheren Auslesens der MRAM-
35 Anordnung von Fig. 8 zu vermeiden, wurde bereits ein in Fig. 9 skizzierter MRAM vorgeschlagen, bei dem jede einzelne

Speicherzelle aus einer MTJ-Schichtfolge 4 und einem Auswahltransistor 5 besteht. Ein Einschreiben in eine durch eine Strichlinie 6 umgebene Speicherzelle erfolgt, indem durch die Wortleitung WL2 und die Bitleitung BL2 entsprechende Ströme geschickt werden. Dadurch wird die MTJ-Schichtfolge 4 dieser Speicherzelle in entsprechender Weise programmiert. Zum Auslesen werden Selectleitungen SL11 und SL13 so angesteuert, dass die mit diesen verbundenen Auswahltransistoren 5 alle gesperrt sind. Dagegen wird an eine Selectleitung SL12 eine solche Spannung angelegt, dass die mit dieser Leitung verbundenen Auswahltransistoren 5 leiten. Sodann wird an eine Selectleitung SL22 der Selectleitungen SL21 bis SL23 ein Lesesignal angelegt. Dieses fließt über die MTJ-Schichtfolge der durch die Strichlinie 6 umgebenen Speicherzelle, da nur der Auswahltransistor dieser Speicherzelle leitet, während alle anderen Auswahltransistoren der übrigen Speicherzellen gesperrt sind. Am Ausgang der Selectleitung SL22 kann somit ein den Zustand der MTJ-Schichtfolge 4 anzeigendes Signal, also ein Informationsinhalt "0" oder "1" erhalten werden.

Mit der MRAM-Anordnung der Fig. 9 können parasitäre Effekte benachbarter Speicherzellen praktisch ausgeschaltet werden. Somit ist die Zeit für einen Lesezugriff sehr klein. Nachteilhaft an dem MRAM von Fig. 9 ist jedoch, dass der Vorteil einer hochdichten Gestaltung verloren ist, da nur noch eine effektive Zellfläche von $8 F^2$ erreicht werden kann.

Um den obigen Konflikt zwischen Flächenbedarf (" F^2 ") einerseits und schnellem Lesezugriff ohne parasitäre Effekte andererseits zu lösen, wurde bei vollkommen anderen Speicheranordnungen, nämlich DRAM-Anordnungen (DRAM = dynamischer RAM) bereits daran gedacht, sogenannte geteilte bzw. "shared contacts" einzusetzen, bei denen ein Kontakt eines Auswahltransistors von mehreren, bevorzugt von zwei Speicherzellen benutzt und damit Fläche (" F^2 ") eingespart wird. Für MRAMs

ist diese Lösung aber nicht anwendbar, so dass auch die obige Problematik bisher nicht gelöst wurde.

Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine MRAM-Anordnung zu schaffen, die bei minimalem Flächenbedarf einen raschen Lesezugriff erlaubt.

Diese Aufgabe wird bei einer MRAM-Anordnung der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass in den Speicherzellen jeweils eine MTJ-Schichtfolge und die Drain-Source-Strecke eines Auswahltransistors parallel zueinander liegen, so dass die zweiten Selectleitungen durch die in Reihe zueinander liegenden Source-Drain-Strecken der Auswahltransistoren gebildet sind.

Bei der erfindungsgemäßen MRAM-Anordnung liegen also die Auswahltransistoren und die MTJ-Schichtfolgen der einzelnen Speicherzellen parallel zueinander. Diese Speicherzellen oder "Grundelemente" sind sodann zu Ketten zusammengefügt, wobei parallel zueinander verlaufende Ketten eine Speichermatrix bilden. Die Auswahl einer Kette in einer solchen Speichermatrix kann durch einen gesonderten Auswahltransistor erfolgen. Das heißt, jeder einzelnen Kette wird ein gesonderter Auswahltransistor an einem Ende von der Kette zugeordnet.

Das Einschreiben in die erfindungsgemäße MRAM-Anordnung erfolgt in üblicher Weise, indem an die gewünschten Wort- und Bitleitungen jeweils ein entsprechendes Signal angelegt wird. Beim Auslesen wird über die gesonderten Auswahltransistoren zunächst eine Kette der Speichermatrix festgelegt. Sodann werden alle Transistoren dieser Kette bis auf den Transistor der Speicherzelle, deren Zellinhalt gelesen werden soll, durchgeschaltet. Der Transistor der zu lesenden Speicherzelle bleibt also gesperrt. Wird sodann durch die Kette dieses zu lesenden Transistors ein Strom geschickt, so

fließt der Strom allein durch die MTJ-Schichtfolge der zu lesenden Speicherzelle und durch alle Auswahltransistoren der übrigen Speicherzellen der Kette. Damit kann der Zellinhalt der zu lesenden Speicherzelle bestimmt werden.

5

Die erfindungsgemäße MRAM-Anordnung zeichnet sich durch einen geringen Flächenbedarf aus: in der Kette hat bei entsprechender Gestaltung eine Speicherzelle aus einer MTJ-Schichtfolge und einem parallel zu dieser liegenden Auswahltransistor eine effektive Zellfläche von $4 F^2$. Hierzu muss der gesonderte Auswahltransistor einer Kette gezählt werden, der wiederum eine Fläche von $4 F^2$ benötigt. Damit ergibt sich für eine Kette mit N Speicherzellen eine effektive Zellfläche für jede Speicherzelle von $4 F^2 (N + 1)/N$.

15

Es sei angemerkt, dass im Falle von $N = 1$, also einer aus nur einer Speicherzelle bestehenden Kette, eine effektive Zellfläche von $8 F^2$ vorliegt, was genau der bisher bekannten Lösung aus einer Serienschaltung von einem Auswahltransistor mit einer MTJ-Schichtfolge entspricht. Dies bedeutet, dass die Erfindung dann besonders vorteilhaft einsetzbar ist, wenn bei einer MRAM-Anordnung die Bedingung $N > 1$ vorliegt, was selbstverständlich für sämtliche in Speichermatrizen angeordnete Speicherzellen gilt.

25

Bei der vorliegenden Erfindung wird in vollkommen neuartiger Weise von dem bisher üblichen Prinzip einer Serienschaltung einer MTJ-Schichtanordnung und eines Auswahltransistors abgegangen und ein neuartiges Konzept vorgeschlagen, bei dem die MTJ-Schichtfolge und der Auswahltransistor in jeder Speicherzelle parallel zueinander liegen und zu Ketten zusammengefügt sind.

30

35

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein schematisches Schaltbild einer Kette einer MRAM-Anordnung gemäß der vorliegenden Erfindung,

5 Fig. 2 eine Speichermatrix einer MRAM-Anordnung gemäß der vorliegenden Erfindung,

Fig. 3 einen Schnitt eines Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen MRAM-Anordnung,

10 Fig. 4 eine Aufsicht auf die MRAM-Anordnung des Ausführungsbeispiels von Fig. 3,

Fig. 5 eine MTJ-Schichtfolge in Perspektive,

15 Fig. 6 eine Darstellung zur Erläuterung des Speicherzustandes in einer MTJ-Schichtfolge gemäß Fig. 5,

Fig. 7 eine Darstellung einer MTJ-Schichtfolge mit einer Wortleitung und einer Bitleitung,

20 Fig. 8 eine Speichermatrix mit MTJ-Schichtfolgen gemäß den Fig. 5 bis 7 und

25 Fig. 9 eine Speichermatrix einer herkömmlichen MRAM-Anordnung.

Die Fig. 5 bis 9 sind bereits eingangs erläutert worden.

30 In den Figuren werden für einander entsprechende Bauteile jeweils die gleichen Bezugszeichen verwendet.

Fig. 1 zeigt eine Kette einer MRAM-Anordnung nach einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung mit Auswahltransistoren 5 und MTJ-Schichtfolgen 4, die jeweils parallel zu-
35 einander liegen. Das heißt, über den Drain-Source-Strecken der Auswahltransistoren 5 liegt jeweils eine MTJ-

Schichtfolge 4, welche ihrerseits in der Kette in Reihe zueinander geschaltet sind, wie dies auch für die Drain-Source-Strecken der Auswahltransistoren 5 gilt.

- 5 Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen MRAM-Anordnung. Hier liegen mehrere der in Fig. 1 gezeigten Ketten mit MTJ-Schichtfolgen 4 und Auswahltransistoren 5 parallel zueinander, wobei zusätzlich mit jeder Kette noch ein gesonderter Auswahltransistor 7 verbunden ist. Zusätzlich sind in Fig. 2 noch erste Selectleitungen SL1 sowie Zeilen- bzw. Row-Selectleitungen RSL gezeigt, die jeweils durch die gesonderten Auswahltransistoren 7 und die Drain-Source-Strecken der Auswahltransistoren 5 gebildet sind.
- 10
- 15 Soll eine bestimmte Speicherzelle, beispielsweise eine Speicherzelle Z2 der in Fig. 1 gezeigten Kette ausgelesen werden, so wird zunächst der gesonderte Auswahltransistor 7 dieser Kette leitend geschaltet, während alle übrigen gesonderten Auswahltransistoren der Speichermatrix abgeschaltet bzw. nichtleitend verbleiben. Sodann wird in dieser Kette durch Anlegen eines entsprechenden Signales an die der Speicherzelle Z2 zugeordnete Selectleitung SL1 der Auswahltransistor 5 der Speicherzelle Z2 nichtleitend geschaltet, während alle übrigen Auswahltransistoren 5 der Kette in den leitenden Zustand überführt werden. Damit liegt in der Kette ein Strompfad I1 vor, wie dieser in einer Volllinie mit Pfeil schematisch in Fig. 1 angedeutet ist. Dies bedeutet, der Widerstandszustand der MTJ-Schichtfolge der Speicherzelle Z2 kann ohne weiteres ausgelesen werden.
- 20
- 25
- 30
- 35 Das Einlesen erfolgt in die in den Fig. 1 und 2 gezeigte MRAM-Anordnung in üblicher Weise. Das heißt, die MTJ-Schichtfolgen 4 liegen jeweils zwischen Bitleitungen BL und Wortleitungen WL, wie dies in einem konkreten Ausführungsbeispiel in den Fig. 3 und 4 dargestellt ist, von denen die Fig. 3 eine Schnittdarstellung und die Fig. 4 eine Aufsicht

darstellen. Die neben diesen Figuren gezeigte Legende gilt dabei für beide Figuren.

Wie aus den Fig. 3 und 4 zu ersehen ist, liegen die MTJ-Schichtfolgen 4 zwischen Wortleitungen WL und diese senkrecht kreuzenden Bitleitungen BL. Indem entsprechende Ströme durch die Wortleitungen WL bzw. Bitleitungen BL geschickt werden, können an den Kreuzungsstellen von solchen Wortleitungen und Bitleitungen gelegene MTJ-Schichtfolgen 4 programmiert werden, wie dies oben erläutert wurde.

Das Auslesen erfolgt so, wie dies oben anhand der Fig. 1 und 2 beschrieben wurde: der gesonderte Auswahltransistor 7 der Kette mit der auszulesenden Speicherzelle wird leitend geschaltet, während alle anderen gesonderten Auswahltransistoren 7 gesperrt verbleiben. Sodann wird der Auswahltransistor 5 der auszulesenden Speicherzelle in dieser Kette durch entsprechende Ansteuerung der Selectleitung SL1 gesperrt bzw. nichtleitend geschaltet, während alle übrigen Auswahltransistoren dieser Kette durch entsprechende Ansteuerung ihrer Gates über die Selectleitungen SL1 in den leitenden Zustand überführt werden. In der Speicherzelle mit dem gesperrten Transistor, also in der auszulesenden Speicherzelle, fließt dann der Lesestrom über die Row-Selectleitung RSL, das heißt über die Drain-Source-Strecken der Auswahltransistoren der nicht ausgewählten Speicherzellen der Kette und über die MTJ-Schichtfolge 4 der ausgewählten Speicherzelle mit dem gesperrten Auswahltransistor 5. Auf diese Weise kann rasch und ohne parasitäre Ströme der Zellinhalt der ausgewählten Speicherzelle ausgelesen werden.

In den Fig. 3 und 4 sind auch die "minimum feature sizes" F der einzelnen Speicherzellen mit jeweils 2 F veranschaulicht.

Die Erfindung ermöglicht so eine einfach aufgebaute MRAM-Anordnung, die vollkommen von dem bisherigen Konzept einer Reihenschaltung von Auswahltransistor und Speicherzelle abgeht und statt dessen eine Parallelschaltung von Auswahl-

5 transistor und MTJ-Schichtfolge vorsieht. Durch diesen anderen Aufbau kann eine hohe Packungsdichte gewährleistet werden, so dass die oben angegebene Aufgabe der Erfindung in hervorragender Weise gelöst wird.

- 10 Wie aus Fig. 3 zu ersehen ist, verlaufen bei der erfindungsgemäßen MRAM-Anordnung die Bitleitungen BL oberhalb der Auswahltransistoren 5 und speziell oberhalb von deren Gate-Elektroden im Abstand von diesen.

Patentansprüche

1. MRAM-Anordnung aus einer Vielzahl von in einer Speicher-
matrix angeordneten Speicherzellen (Z2), deren jede aus we-
5 nigstens einer MTJ-Schichtfolge (4) und einem Auswahltransi-
stor (5) besteht, von denen die MTJ-Schichtfolgen (4) je-
weils zwischen Wortleitungen (WL) und Bitleitungen (BL), die
im Abstand voneinander verlaufen, gelegen sind, die Auswahl-
transistoren (5) an ihren Gates zum Auslesen der Speicher-
10 zellen mit Selectleitungen (SL1) verbunden sind und die MTJ-
Schichtfolgen (4) an zweite Selectleitungen (RSL) ange-
schlossen sind,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass in den Speicherzellen (Z2) jeweils eine MTJ-
15 Schichtfolge (4) und die Drain-Source-Strecke eines Auswahl-
transistors (5) parallel zueinander liegen, so dass die
zweiten Selectleitungen (RSL) durch die in Reihe zueinander
liegenden Source-Drain-Strecken der Auswahltransistoren (5)
gebildet sind.

2. MRAM-Anordnung nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die zweiten Selectleitungen (RSL) einer Kette von Spei-
cherzellen in der Speichermatrix in Reihe zu gesonderten
25 Auswahltransistoren (7) liegen.

3. MRAM-Anordnung nach Anspruch 1 oder 2,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die Auswahltransistoren (5) an ihren Gates mit den er-
30 sten Selectleitungen (SL1) verbunden sind.

4. MRAM-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die Mindestabmessung einer Speicherzelle durch $4 F^2$ ge-
35 geben ist, wobei F die "minimum feature size" der verwen-
deten Technologie bedeutet.

5. MRAM-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die ersten Selectleitungen (SL1) über den Gates der
5 Auswahltransistoren (5) geführt sind.



6. MRAM-Anordnung nach Anspruch 4 oder 5,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die ersten Selectleitungen (SL1) und die Bitleitungen
10 parallel zueinander verlaufen.

Zusammenfassung

MRAM-Anordnung

- 5 Die Erfindung betrifft eine MRAM-Anordnung, bei der die Auswahltransistoren (5) und die MTJ-Schichtfolgen (4) in einer Zelle jeweils parallel zueinander liegen. Dadurch lässt sich eine beträchtliche Flächeneinsparung erzielen.

10 (Fig. 1)



Bezugszeichenliste

1	Tunnelbarrierenschicht
2	weichmagnetische Schicht
3	hartmagnetische Schicht
4	MTJ-Schichtfolge
BL, BL1, BL2	Bitleitungen
WL, WL1, WL2, WL3	Wortleitungen
5	Auswahltransistor
6	Strichlinie
7	gesonderter Auswahltransistor
Z2	Speicherzelle

Figur für die Zusammenfassung

Fig. 1

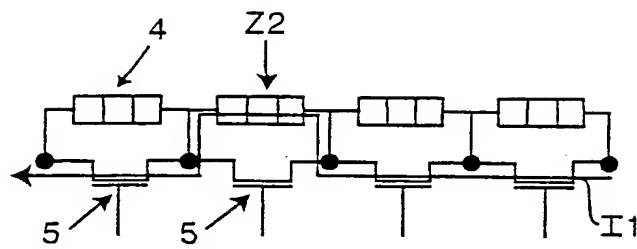


Fig. 1

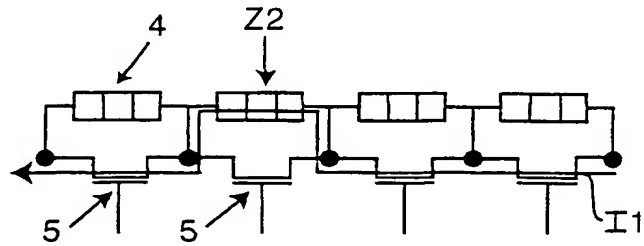


Fig. 2

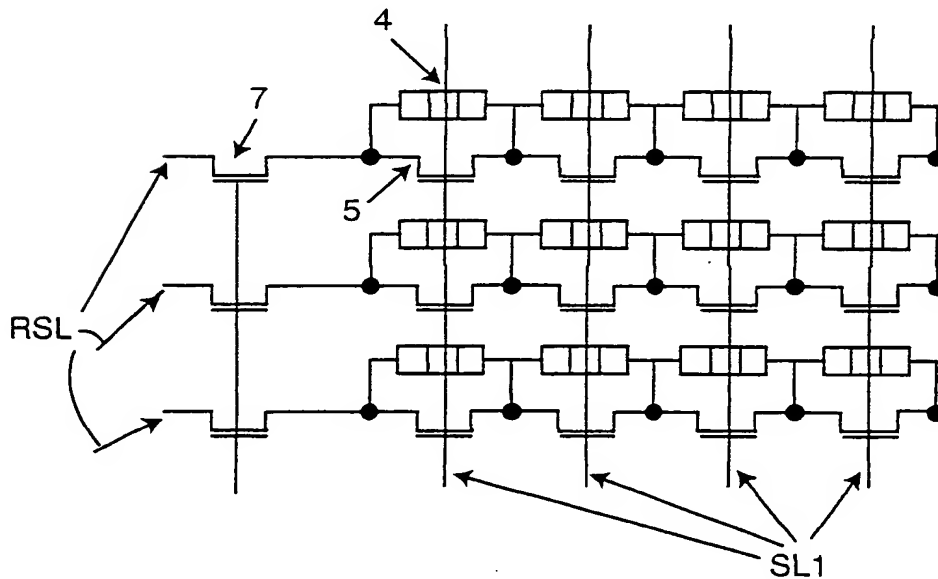
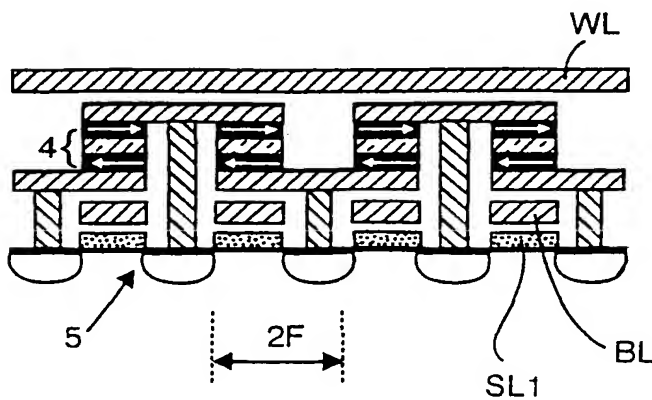


Fig. 3



Legende

-  Metall
-  Magnetschicht (2, 3)
-  Tunnelbarriere (1)
-  Kontakt (8)
-  Diffusion
-  Gate (SL1)

Fig. 4

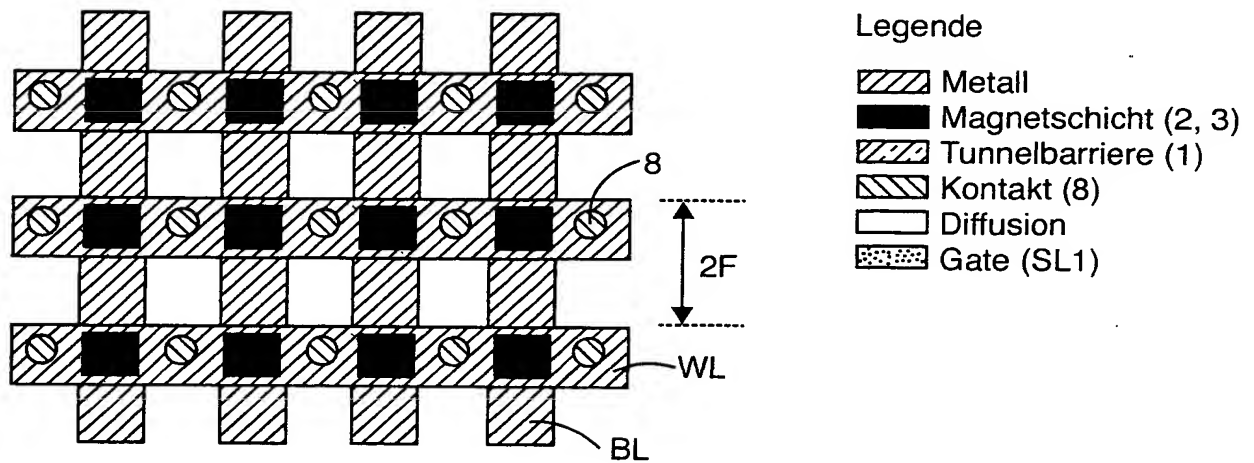


Fig. 5

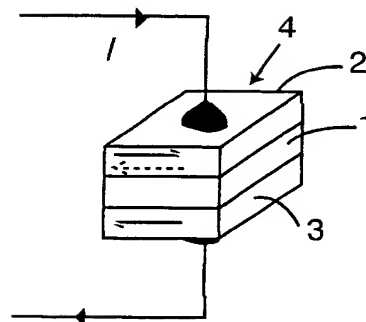


Fig. 6

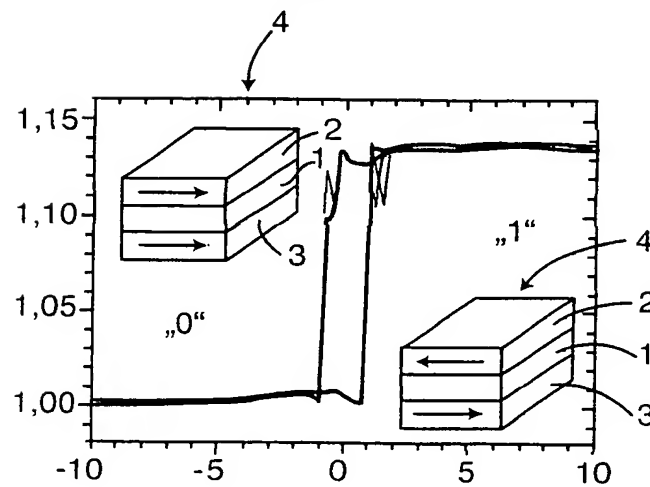


Fig. 7

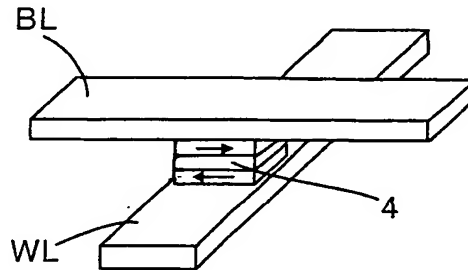


Fig. 8

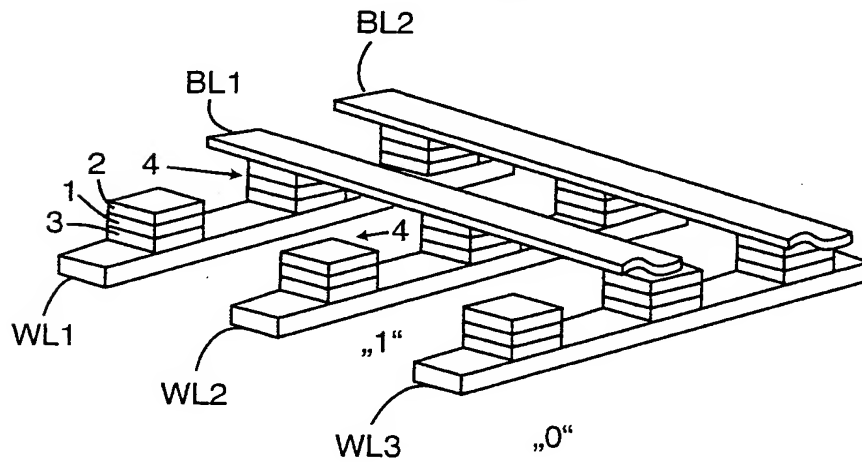


Fig. 9

